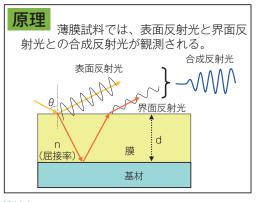
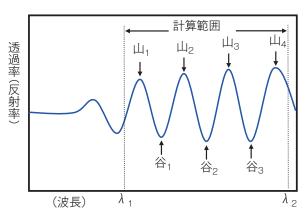


紫外・可視分光光度計による膜厚評価

京都府中小企業技術センターでは、中小企業が持つ「強み」を活かして力強く活動できるよう、技 術開発等に関する支援を行うため、高度な試験・研究用機器を設置し、依頼試験や機器貸付を行っ ています。ここでは、非破壊試験による膜厚測定の業務紹介をします。

分光光度計は、光線透過率・反射率を測定する装置であり、工業、化学、食品、環境、製薬など幅広い分野でご利用頂いています。 当センター所有の紫外・可視分光光度計(UV-2550、株式会社島津製作所)は、測定された透過率や反射率データを用いて、非破 壊・非接触で簡便に膜厚を評価することができます。





「膜厚計算法」

- ①干渉波形(反射率スペクトル)の山と谷(山、谷の検出は自動)の波長より、屈折率(計算する波長範囲では一定)と入射角を既知として、下記 式より膜厚(d)を求めます。
- ②指定した波長範囲のすべての山と谷の波長を用い、最小2乗法により膜厚の計算を行います。ただし、干渉パターンが観測されない試料や 測定面が平坦かつ鏡面でない試料では適用できません。

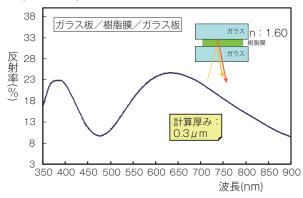
$$d = \frac{\Delta m}{2\sqrt{n^2 - \sin^2 \theta}} \cdot \frac{1}{\left[\frac{1}{\lambda_2} - \frac{1}{\lambda_1}\right]}$$

適用材料:(平滑で鏡面の測定面をもつ濁りの無い透明体)

- ・ 樹脂フィルム · 有機膜 保護膜 · 反射防止膜
- · DLC膜 フォトレジスト膜
- ·無機系膜(Si3N4, Si02, Al2O3, Ti02, ITO, Zr02等)

測定例

形状の異なる材料の膜厚を入射角5°の反射率データから評価しました。 サブμm~数十μm程度の厚みを評価することが可能です。



京都府中小企業技術センター 応用技術課 表面:微細加工担当

n:屈折率 θ :入射角 λ 2, λ 1: 任意の2つの波長 Δm:λ2, λ1の間の山の数 100 90 Si₃N₄膜/Si板 80 n: 2.10 計算厚み 反射率(% 70 60 40 30 20 10 650 波長(nm) 13 12 計算厚み 11 10 反射率(%) 9 8 7 6 計算厚み

TEL: 075-315-8634 FAX: 075-315-9497 E-mail:ouyou@mtc.pref.kyoto.lg.jp

650

700

800

850

波長(nm)

750

5

4

厚袋

550

600